PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2001-056667

(43) Date of publication of application: 27.02.2001

(51) Int. CI.

G09G G09G 3/20 // H05B 33/14

(21) Application number : 11-231493

(71) Applicant: TDK CORP

(22) Date of filing:

18.08.1999

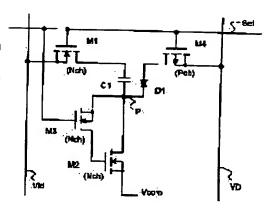
(72) Inventor: TAKAYAMA ICHIRO

(54) PICTURE DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate the adverse effect of characteristic fluctuation caused by polysilicon grain diameters and to reduce the fluctuation of the display

SOLUTION: The device has a second switching element M2 which is connected to a display element D1 and directly drives the element D1, a third switching element M3 which becomes in an active state by selection signals Sel and connects one of terminals to be controlled (drains) and a control terminal (a gate) of the element M2, and a first switching element M1 which becomes in an active state by the signal Sels and forms an electrically conductive path to provide driving signals to other terminals to be controlled (a drain) of the element M2. During a selecting period, the elements M2 and M3 form a self bias circuit. Moreover, a driving current storage means (a capacitive component C1 between the elements M1 and M2) is provided to give driving signals corresponding to driving current for the element M2, hold the signals as the operating voltage of the element M2 in accordance with the characteristic of the element M2 during a nonselecting period and drives the element D1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejectionl

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-56667 (P2001-56667A)

(43)公開日 平成13年2月27日(2001.2.27)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I		テーマコード(参考)	
G 0 9 G	3/30		G 0 9 G	3/30	J	3 K 0 0 7
	3/20	6 2 4		3/20	624B	5 C 0 8 0
// H05B 3	33/14		H05B	33/14	Α	

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 12 頁)

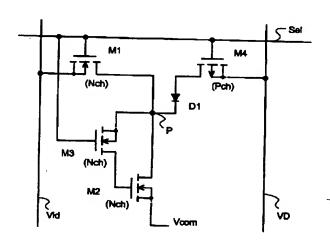
(21)出願番号	特顯平11-231493	(71)出題人 000003067
		ティーディーケイ株式会社
(22) 出顧日	平成11年8月18日(1999.8.18)	東京都中央区日本橋1丁目13番1号
		(72)発明者 高山 一郎
	· · · · · ·	東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
		ーディーケイ株式会社内
		(74)代理人 100082865
		弁理士 石井 陽一
		Fターム(参考) 3K007 AB03 BA06 BB07 CA02 DA00
		DB03 EB00 FA01 FA03
		50080 AA06 BB05 DD30 EE29 FF11
		JJ02 JJ03 JJ05 JJ06

(54) 【発明の名称】 画像表示装置

(57)【要約】

【課題】 Poly-Siの粒径による特性のばらつきの影響をなくし、表示面のばらつきを改善する。

【解決手段】 表示素子と接続され、これを直接駆動する第2のスイッチング素子と、選択信号により能動状態となり、前記第2のスイッチング素子の一方の被制御端子と制御端子とを接続する第3のスイッチング素子と、選択信号により能動状態となり、前記第2のスイッチング素子の他方の被制御端子に駆動信号を与える導通路を形成する第1のスイッチング素子とを有し、選択時に記第2のスイッチング素子と第3のスイッチング素子と第3のスイッチング素子と取動電流に対応した駆動信号を与え、非選択時にこれを第2のスイッチング素子の特性に応じた東2のスイッチング素子の動作電圧として保持して前記表示素子を駆動する駆動電流記憶手段を有する画像表示装置とした。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示素子と接続され、これを直接駆動す る第2のスイッチング素子と、

選択信号により能動状態となり、前記第2のスイッチン グ素子の一方の被制御端子と制御端子とを接続する第3 のスイッチング素子と、

選択信号により能動状態となり、前記第2のスイッチン グ素子の他方の被制御端子に駆動信号を与える導通路を 形成する第1のスイッチング素子とを有し、

選択時に前記第2のスイッチング素子と第3のスイッチ ング素子とでセルフバイアス回路を形成し、かつこの第 2のスイッチング素子に駆動電流に対応した駆動信号を 与え.

非選択時にこれを第2のスイッチング素子の特性に応じ た第2のスイッチング素子の動作電圧として保持して前 記表示素子を駆動する駆動電流記憶手段を有する画像表

【請求項2】 前記表示素子は、電流駆動され、この駆 動電流に応じた発光を行う請求項1の画像表示装置。

【請求項3】 前記駆動信号は、駆動電流に応じた電流 20 信号として与えられ、かつこれを第2のスイッチング素 子の被制御端子に与えることにより、その1/V特性か ら得られた電圧値を保持する請求項1または2の画像表 示装置。

【請求項4】 前記発光素子と接続され、選択信号によ り禁止状態となり、非選択時に前記発光素子を電源と接 続する第4のスイッチング素子を有する請求項1~3の いずれかの画像表示装置。

【請求項5】 前記第1のスイッチング素子と第2のス イッチング素子との間には駆動信号を電圧/電流変換す 30 るための容量成分を有し、

前記駆動信号は駆動電流に対応した電圧信号として与え られるとともに、前記容量成分によりこの駆動信号を電 圧/電流変換して第2のスイッチング素子に与える請求 項1~4のいずれかの画像表示装置。

【請求項6】 前記駆動信号は、前記表示素子の駆動電 流に対応した増加率を有するのとぎり波状の形である請 求項5の画像表示装置。

【請求項7】 前記表示素子と電源との間に配置され、 選択信号により禁止状態となり、非選択時に表示素子と 40 電源とを接続する第4のスイッチング索子を有する請求 項5または6のいずれかの画像表示装置。

【請求項8】 その制御端子が選択線Sel に接続され るとともに、被制御端子の一端が表示素子の一端と、第 3のスイッチング索子の被制御端子の他端と、第2のス イッチング素子の被制御端子の一端とに接続され、その 被制御端子の他端が駆動信号を与えるビデオ信号線と接 続されているている第1のスイッチング素子と、

その制御端子が選択線と接続され被制御端子の一端が第

御端子の他端が前記第1のスイッチング素子の被制御端 子の一端と、表示素子の一端と、第2のスイッチング素 子の被制御端子の一端とに接続されている第3のスイッ チング素子と、

2

その被制御端子の他端が、接地線に接続され、その被制 御端子の一端が、表示素子の一端と、第3のスイッチン グ素子の被制御端子の他端と、第1のスイッチング素子 の被制御端子の一端とに接続されている第2のスイッチ ング素子と、

その制御電極が選択線と接続され、被制御端子の一端が 表示素子の他端と接続され、その他端は電源線と接続さ れている第4のスイッチング素子と、

これらのスイッチング素子により駆動される表示素子と を有する画像表示装置。

その制御端子が選択線に接続されるとと 【請求項9】 もに、被制御端子の一端が容量の一端に接続され、その 被制御端子の他端は、駆動信号を与えるビデオ信号線と 接続されている第1のスイッチング素子と、

その制御端子が、選択線と接続され、被制御端子の他端 は、容量の他端と、第4のスイッチング素子の被制御端 子の他端と、第2のスイッチング素子の被制御端子の一 端と接続され、その被制御端子の一端は、第2のスイッ チング素子の制御端子と接続されている第3のスイッチ ング素子と、

その被制御端子の他端は、電源線と接続され、その被制 御端子の一端は、第3のスイッチング素子の被制御端子 の他端と、容量の他端と、第4のスイッチング素子の被 制御端子の他端と接続されている第2のスイッチング素 子と、

その被制御端子の他端は、第3のスイッチング素子の被 制御端子の他端と、容量の他端と、第2のスイッチング 素子の被制御端子の一端と接続され、その制御電極は、 選択線と接続され、その被制御端子の一端は、表示素子 の他端と接続されている第4のスイッチング素子と、 その一端が、接地線と接続され、これらのスイッチング 素子により駆動される表示素子とを有する画像表示装 置。

【請求項10】 前記第1のスイッチング素子~第3の スイッチング素子はポリシリコンTFTである請求項1 ないし9のいずれかの画像表示装置。

【請求項11】 前記表示素子は、有機EL素子である 請求項1~10のいずれかの画像表示装置。

【請求項12】 前記選択線から選択信号を入力してい る期間にビデオ信号線から駆動信号を入力し、非選択時 に表示素子を駆動する請求項1~11のいずれかの画像 表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は画像表示装置に関 2のスイッチング素子の制御端子と接続され、その被制 50 し、特に有機エレクトロルミネセンス(EL)表示装置 3

に好適な、高画質の画像表示装置に関する。 【0002】

【従来の技術】近年において、有機EL素子を用いた表示装置が開発されている。有機EL素子を多数使用した有機EL素子装置をアクティブマトリックス回路により駆動する場合、各ELのピクセル(画素)には、このピクセルに対して供給する電流を制御するための薄膜トランジスタ(TFT)の如きFET(電界効果トランジスタ)が一組ずつ接続されている。すなわち有機EL素子に駆動電流を流すバイアス用のTFTと、そのバイアス 10用TFTを選択すべきかを示すスイッチ用のTFTが一組ずつ接続されている。

【0003】従来のアクティブマトリックス型の有機EL表示装置の回路図の一例を図17,18に示す。この有機EL表示装置は、X方向信号線X1,X2…、Y方向信号線Y1,Y2…、電源Vdd線Vdd1,Vdd2…、スイッチ用TFTトランジスタTy11,12、Ty21,22…、電流制御用TFTトランジスタM11,12、M21,22…、有機EL素子EL110,120、EL210,220…、コンデンサC11,12、C21,22…、X方向周辺駆動回路12,Y方向周辺駆動回路13等により構成される。

【0004】 X方向信号線 X1, X2、 Y方向信号線 Y1, Y2により画素が特定され、その画素においてスイッチ用TFTトランジスタTy11, 12、Ty21, 22がオンにされてその信号保持用コンデンサC11, 12、C21, 22に画像データが保持される。これにより、電流制御用のTFTのTFTトランジスタM11, 12、M21, 22がオンにされ、電源線 Vdd1、Vdd2により有機 EL素子EL110, 120、EL210, 220に画像データに応じたパイアス用の電流が流れ、これが発光される。

【0005】例えばx方向信号線X1に画像データに応 じた信号が出力され、Y方向信号線Y1にY方向走査信 号が出力されると、これにより特定された画素のスイッ **チ用TFTトランジスタTy11がオンになり、画像デ** ータに応じた信号により電流制御用TFTトランジスタ M11が導通されて有機EL素子L110に、この画像 データに応じた発光電流が流れ、発光制御される。この ように、画素毎に、薄膜型のEL素子と、前記EL素子 の発光制御用の電流制御用TFTトランジスタと、前記 電流制御用TFTトランジスタのゲート電極に接続され た信号保持用のコンデンサと、前記キャパシタへのデー タ書き込み用のスイッチ用のTFTトランジスタ等を有 するアクティブマトリックス型EL画像表示装置におい て、EL素子の発光強度は、信号保持用のキャパシタに 蓄積された電圧によって制御された発光電流制御用の非 線形素子であるTFTトランジスタに流れる電流で決定 される(A66-in 201pi Electroluminescent Display T. P.Brody、F.C.Luo、et.al、IEEE Trans ElectronI)evices、 50 Vol. ED-22、No. 9、Sep. 1975, P739-P749参照)。 【0006】このとき、使用される信号保持用のコンデンサの容量は、微少な選択時間内で画素スイッチTFTトランジスタが十分に電荷を充電できる容量以下であり、また、この画素スイッチTFTトランジスタの非選択時のリーク電流が次の書き込み時間まで失わせる電荷により発生するコンデンサの保持電圧の低下が表示パネルの画像に悪影響を与えない容量以上であることが求められる。

(0007)ところで、アクティブマトリックスの表示 装置は、その視認性から拡大投影を行う光学系を用いない場合は、4インチ以上の画角が要求される。

【0008】このサイズの表示面をシリコン単結晶基板上に構成することは、現在の単結晶Si基板の製作技術では1枚の単結晶基板から得られる枚数が非常に少ないため大変コストがかかってしまう。

【0009】そこで、アクティブマトリックスの表示装置では、ガラス基板等の平面基板上に作成した非単結晶 Si等の半導体層を用いた薄膜トランジスタ (TFT) を使用することが望ましい。

【0010】ところで、平面基板上に形成される半導体層は大面積のものが比較的容易に成膜できることから、アモルフアスSi膜(以下a-Si膜という)を用いることが一般的である。

【0011】しかし、a-Si膜で形成されたTFTは、一方向に定常的に電流を流し続けると、しきい値がドリフとして電流値が変わり、画質に変動が生ずる。しかも、a-Si膜では移動度が小さいため高速応答でドライブできる電流にも限界があり、またPチャネルの形成が困難なところより、小規模なc-MOS回路の構成さえも困難である。

【0012】そのため、アクティブマトリックス型有機 EL画像表示装置の半導体層としては、比較的大面積化 が容易でかつ高信頼性で移動度も高く、CMOS回路の 形成も可能なPoly-Siを用いることが望ましい。 【0013】ところで、Poly-Si層を用いて形成 されたTFTは、そのチャネル中に存在する結晶粒界の 数によりトラップ準位密度が変化し、これが特性に影響を与える。そのためチャネル長、又はチャネル幅が結晶 の粒径に近づくにつれチャネル中に存在する粒界の数の 変動の割合が大きくなる。これはチャネル中のトラップ 準位密度の変動割合の増大、ひいてはTFTの特性ばらつきの増大を引き起こす。このTFTの特性ばらつきの増大は表示装置の画質の低下を引き起こすので望ましくない。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、Poly-Siの粒径による特性のばらつきの影響をなくし、表示面のばらつきを改善することである。

0 [0015]

【課題を解決するための手段】すなわち、上記目的は以 下の構成により達成される。

- 表示素子と接続され、これを直接駆動する第2 のスイッチング素子と、選択信号により能動状態とな り、前記第2のスイッチング素子の一方の被制御端子と 制御端子とを接続する第3のスイッチング素子と、選択 信号により能動状態となり、前記第2のスイッチング素 子の他方の被制御端子に駆動信号を与える導通路を形成 する第1のスイッチング素子とを有し、選択時に前記第 2のスイッチング素子と第3のスイッチング素子とでセ 10 ルフバイアス回路を形成し、かつこの第2のスイッチン グ索子に駆動電流に対応した駆動信号を与え、非選択時 にこれを第2のスイッチング素子の特性に応じた第2の スイッチング素子の動作電圧として保持して前記表示素 子を駆動する駆動電流記憶手段を有する画像表示装置。
- (2)前記表示素子は、電流駆動され、この駆動電流 に応じた発光を行う上記(1)の画像表示装置。
- 前記駆動信号は、駆動電流に応じた電流信号と (3) して与えられ、かつこれを第2のスイッチング素子の被 制御端子に与えることにより、その I / V 特性から得ら 20 れた電圧値を保持する上記(1)または(2)の画像表 示装置。
- (4) 前記発光素子と接続され、選択信号により禁止 状態となり、非選択時に前記発光素子を電源と接続する 第4のスイッチング素子を有する上記(1)~(3)の いずれかの画像表示装置。
- (5) 前記第1のスイッチング素子と第2のスイッチ ング素子との間には駆動信号を電圧/電流変換するため の容量成分を有し、前記駆動信号は駆動電流に対応した 電圧信号として与えられるとともに、前記容量成分によ 30 りこの駆動信号を電圧/電流変換して第2のスイッチン グ素子に与える上記(1)~(4)のいずれかの画像表 示装置。
- (6) 前記駆動信号は、前記表示素子の駆動電流に対 応した増加率を有するのとぎり波状の形である上記 (5)の画像表示装置。
- 前記表示素子と電源との間に配置され、選択信 号により禁止状態となり、非選択時に表示素子と電源と を接続する第4のスイッチング素子を有する上記(5) または(6)のいずれかの画像表示装置。

【0016】(8) その制御端子が選択線Sel に接 続されるとともに、被制御端子の一端が表示素子の一端 と、第3のスイッチング素子M3の被制御端子の他端 と、第2のスイッチング素子M2の被制御端子の一端と に接続され、その被制御端子の他端が駆動信号を与える ビデオ信号線Vid と接続されているている第1のスイ ッチング素子M1と、その制御端子が選択線Sel と接 続され被制御端子の一端が第2のスイッチング素子M2 の制御端子と接続され、その被制御端子の他端が前記第

素子D1の一端と、第2のスイッチング素子M2の被制 御端子の一端とに接続されている第3のスイッチング素 子M3と、その被制御端子の他端が、接地線Vcom に接 続され、その被制御端子の一端が、表示素子D1の一端 と、第3のスイッチング素子M3の被制御端子の他端 と、第1のスイッチング素子M1の被制御端子の一端と に接続されている第2のスイッチング素子と、その制御 電極が選択線Sel と接続され、被制御端子の一端が表 示素子Dlの他端と接続され、その他端は電源線VDと 接続されている第4のスイッチング素子M4と、これら のスイッチング素子MI~M4により駆動される表示素 子D1とを有する画像表示装置。

[0017](9)その制御端子が選択線Selに接 続されるとともに、被制御端子の一端が容量C1の一端 に接続され、その被制御端子の他端は、駆動信号を与え るビデオ信号線Vid と接続されている第1のスイッチ ング素子M 1 と、その制御端子が、選択線 S e1 と接続 され、被制御端子の他端は、容量C1の他端と、第4の スイッチング素子M4の被制御端子の他端と、第2のス イッチング素子M2の被制御端子の一端と接続され、そ の被制御端子の一端は、第2のスイッチング素子M2の 制御端子と接続されている第3のスイッチング素子M3 と、その被制御端子の他端は、電源線VDと接続され、 その被制御端子の一端は、第3のスイッチング素子M3 の被制御端子の他端と、容量Clの他端と、第4のスイ ッチング素子M4の被制御端子の他端と接続されている 第2のスイッチング素子M2と、その被制御端子の他端 は、第3のスイッチング素子M3の被制御端子の他端 と、容量C1の他端と、第2のスイッチング素子M2の 被制御端子の一端と接続され、その制御電極は、選択線 Sel と接続され、その被制御端子の一端は、表示素子 D1の他端と接続されている第4のスイッチング素子M 4と、その一端が、接地線Vcom と接続され、これらの スイッチング素子により駆動される表示素子 D 1 とを有 する画像表示装置。

- (10)前記第1のスイッチング素子~第3のスイッ チング素子はポリシリコンTFTである上記(1)ない し(9)のいずれかの画像表示装置。
- (11)前記表示素子は、有機EL素子である上記 (1)~(10)のいずれかの画像表示装置。
- (12) 前記選択線から選択信号を入力している期間 にビデオ信号線から駆動信号を入力し、非選択時に表示 素子を駆動する上記(1)~(11)のいずれかの画像 表示装置。

【0018】なお、特開平10-319908号公報に は、アクティブマトリクス有機発光ダイオードを駆動す るための回路が記載されている。しかしながら、同公報 で開示されている実施例の回路構成では、所望の電流を 流そうとした時に必要になるバイアスTFTのゲート電 1のスイッチング素子M1の被制御端子の一端と、表示 50 圧を画素外に設けた電流発生回路によってセンスおよび

反転増幅し、これを画案中の容量に再び蓄積している。 電流値のセンスにはソースフオロア回路を用いている (請求項2)。

【0019】すなわち、上記公報ではこの画素外に設けた電流発生回路によってセンスおよび反転増幅し、これを画素中の容量に蓄積しているため、書き込み非選択インターバル、書き込み選択インターバル、発光インターバルという複雑なシーケンスが必要になり、そのためのタイミング回路が必要になる。また外部に必要なセンスおよび反転増幅する回路が必要になり、これもコストを10上昇させてしまう。また非選択インターバルが必要なことにより発光時間が短くなり、画質を低下させてしまう。

【0020】一方、本願発明では、バイアスTFTのゲートをドレインに接続し、これに所望の電流値を入力する自己バイアス回路を構成する事により、外部のセンスおよび反転増幅回路を省く事が可能である。これによって、実施例1.2、4、5のような構成の場合には、どくわずかな書き込み時間と非書き込み時間の2つの動作で制御を行うことができる。このことにより、所望の輝 20度での発光時間を長く取る事を可能にし、高輝度、高画質の表示を可能にしている。

【0021】また、複雑なシーケンスを発生するタイミング回路も省くことを可能にしている。本願の実施例3 および6 においては、上記公知例と同様な3つの動作態様を必要とするが、センスおよび反転増幅回路を省くことは可能である。

[0022]

【発明の実施の形態】本発明の画像表示装置は、例えば 図1に示すように、表示素子D1と接続され、これを直 30 接駆動する第2のスイッチング素子M2と、選択信号S el により能動状態となり、前記第2のスイッチング素 子M2の一方の被制御端子(ドレイン)と制御端子(ゲ ート)とを接続する第3のスイッチング素子M3と、選 択信号Sel により能動状態となり、前記第2のスイッ チング素子M2の他方の被制御端子(ドレイン) に駆動 信号を与える導通路を形成する第1のスイッチング素子 M1とを有し、選択時に前記第2のスイッチング素子M 2と第3のスイッチング素子M3とでセルフバイアス回 路を形成し、かつこの第2のスイッチング素子M2に駆 動電流に対応した駆動信号を与え、非選択時にこれを第 2のスイッチング素子M2の特性に応じた第2のスイッ チング素子M2の動作電圧として保持して前記表示素子 D1を駆動する駆動電流記憶手段を有するものである。 【0023】また、好ましくは前記第1のスイッチング 素子M1と第2のスイッチング素子M2との間には駆動 信号を保持する容量成分C1を有し、前記駆動信号は駆 動電流に対応した電圧信号として与えられるとともに、 前記容量成分C1によりこの駆動信号を電圧/電流変換 して第2のスイッチング素子M2に与える。

【0024】また、好ましくは前記表示素子D1と電源 VDとの間に配置され、選択信号Selにより禁止状態 となり、非選択時に表示素子D1と電源VDとを接続す る第4のスイッチング素子M4を有する。

8

【0025】とのように、駆動電流に対応した電流信号の駆動信号を、第2のスイッチング素子M2に与え、これをそのI/V特性から得られた電圧値として保持し、かつ非選択時に前記表示素子を駆動する駆動電流記憶手段を有することにより、第2のスイッチング素子M2の特性のバラツキに関係なく、一定の電流で表示素子を駆動することができ、輝度ムラや表示ムラを防止し、高品位で均一な表示が可能となる。

【0026】第2のスイッチング素子M2は、表示素子 (通常カソード側)と接地線との間に配置され、所定の 電流値で表示素子を駆動する。この第2のスイッチング 素子M2は、また第1のスイッチング素子M1と第3の スイッチング素子M3が能動状態となることで、図7に 示すように、一方の被制御端子(ドレイン)と制御端子 (ゲート) とが接続されたセルフバイアス回路ないし定 電流回路が形成され、これに所望の電流1Lを流すと、 図8に示すようにP点にはスイッチング素子のI/V特 性に応じた電圧Vpが現れる。とこで、図8に示すよう にスイッチング素子の特性にバラッキがある場合、異な る特性曲線により I しに対応する電圧が V p ' のように 変動する。ところが保持される電圧は、その特性に応じ たVpまたはVp'であり、それぞれに対応する電流値 I Lは一定なので、保持されたV pまたはV p' により 必ず所定の電流 I Lが流れることになる。

【0027】すなわち、第2のスイッチング素子M2は、第1のスイッチング素子M1と第3のスイッチング素子M3とが禁止状態となることで、P点の電圧Vpを制御端子電圧として保持する。そして、このとき制御端子電圧Vpに応じた電流ILを被制御端子に流そうとするので、表示素子D1は所望の電流ILで駆動されることになる。

【0028】なお、図1に示す例では表示素子D1と電源線VDとの間に、制御端子が選択線Se1に接続された第4のスイッチング素子M4が配置されているが、この第4のスイッチング素子M4は非選択時にのみ表示素子D1を駆動するために配置されたもので、選択時には禁止状態となって、電源線VDと表示素子D1とを遮断するものである。

【0029】また、図示例では駆動信号はビデオ信号線 Vid から所定の電流信号として与えられる。

【0030】スイッチング素子としては、一般に用いられているバイボーラトランジスタやFET(電界効果トランジスタ)も使用することができるが、特に薄膜トランジスタであって、c-MOSタイプのものが好ましい。

50 【0031】以下に薄膜トランジスタ (TFT) の一形

.C

態を図を参照しつつ説明する。 図9~17は本発明の画 像表示装置を構成するTFT、特に有機EL素子の駆動 電流を流す発光電流駆動用TFTの製造工程図である。 【0032】(1)図9に示すように、基板101とし て例えば石英基板を使用し、この基板101上にスパッ タ法によりSiO、膜102を約100mの厚さに成膜

【0033】(2)次いで、図9に示すようにこのSi O₂ 膜102の上にアモルフアスSi(a-Si)層1 03を約100nmの厚さでLPCVD法により成膜す る。このとき成膜条件は以下の通りである。

Si, H, ガス

100~500 SCCM

Hе ガス 500 $0.1 \sim 1$ SSCM Torr

加熱温度

圧力

430~500 ℃

【0034】(3)次いで、加熱処理を行い、このa-Si層103を固相成長させてポリシリコンにする。 C の固相成長の条件は、例えば以下の通りである。

N,

1 SLM

処理温度

600 .C

処理時間

5~20 時間

0·1%のPH, が入ったSiH。ガス 200SCCM

処理温度

640 ℃

40

処理時間 0.4 時間

【0038】(7)次に、図14に示すように、所定の パターンに従ったエッチング工程により、ゲート電極1 05とゲート酸化膜104とを形成する。

【0039】(8) さらに、図14に示すように、この ゲート電極105をマスクとして、ソース、ドレイン領 域となるべき部分にイオンドーピング法により、ドーパ 30 ント107、例えばリンをドービングしてゲート電極に 対してセルフアラインとなるようにソース、ドレイン領 域106、109を形成する。

【0040】(9) これらの素子を含む基板を窒素雰囲 気中に600℃で6時間処理し、その後、更に850℃ で30分間加熱し、ドーパントの活性化を行う。

【0041】(10)さらに、図15に示すように、と の基板全体にTEOSを出発材料として、SiO、膜を 層間絶縁膜112として厚さ400 nmに形成する。この SiO』膜の成膜条件は、例えば以下の通りである。

TEOSガス

100 SSCM

加熱温度

700 ℃

またはプラズマTEOS法により下記の条件でS1〇、 膜を成膜する。

TEOSガス

10~50 SCCM

O, ガス

500 SCCM

パワー

50~300 W

処理温度

600 °C

そして、このSiO、膜を形成後、各電極の配線のた め、必要とするパターンに従ってバターニングを行い、 *次に、

処理温度 850

処理時間 0.5~3 時間

このようにしてa-Si層103を、図10に示すよう な活性Si層103aとすることができる。なお、必要 によりレーザーアニールを施してもよい。

10

【0035】(4)次に、図11に示すように、前記 (3) により形成したポリシリコン層103 aをアイラ ンドを形成するためバターニングする。

10 【0036】(5)さらに、図12に示すように、この バターニングしたポリシリコン層103a上にゲート酸 化膜104を形成する。このゲート酸化膜104の形成 条件は、例えば以下の通りである。

H, O,

4 SLM 10 SCCM

処理温度

800 °C

処理時間

5 時間

【0037】(6)次いで、図13に示すように、ゲー ト酸化膜104の上にゲート電極となるシリコン層10 20 5を減圧CVD法により、厚さ250nmに形成する。そ の成膜条件は、例えば以下の通りである。

層間絶縁膜112等を形成する。

【0042】(11)前記の如く形成した薄膜トランジ スタをさらに水素雰囲気中で350℃で1時間加熱処理 し、水素化を行い、半導体層の欠陥準位密度を減少させ る。

【0043】(12)次いで、図15に示すようにドレ イン、ソースなどのコンタクトを形成する。コンタクト は、絶縁膜112を開口した箇所で行う。先ず、常圧C V D 法により、層間絶縁層としてSiO、膜を成膜す る。次いで、層間絶縁層をエッチングしてコンタクトホ ールを形成し、ドレイン、ソース接続部を開口する。 【0044】開口したドレイン、ソース接続部に、それ ぞれドレイン配線電極113、ソース配線電極114を 成膜して、ドレイン、ソース電極と接続する。この場 合、ドレイン、ソース電極のいずれか一方が、表示素子 (有機EL素子)の第1の電極、または第2の電極とし て機能するか、これと接続される。図示例ではホール注 入電極であるITO(116)と接続される。さらに、 ドレイン配線電極113上に絶縁膜115を形成し、同 時に画素部分以外を覆うエッジカバーを形成して図15 に示すようなスイッチング素子を得る。

【0045】なお、ホール注入電極等、表示素子 (有機 E L 素子) の電極との接続には、例えば図16に示すよ うに配線電極114と、ホール注入電極116との間に 両者の接続性を向上させるために、TiN等の接続金属 50 層117を形成するとよい。

【0046】この方法によって得られたTFTを用いて 実施例1に示す回路を、各画素毎にに構成した。

【0047】この時、各TFTのチャネル長、チャネル 幅は以下に示すように設計する。

	チャネル長	チャネル
M 1	5 μπ	15μm
M 2	5 μπ	30 µ m
М3	20 μm	20 µm
M 4	6 μ =	15μ m

が得られると共にスイッチング時のノイズを低減させる ためにもそのゲート容量は小さい事が望ましい。

【0049】一方、M3は、ΦELに十分な電圧を加 え、かつVDS耐圧を持たせるため、②素子特性のばらつ きを軽減させるため、3M1、M2、M4のスイッチン グノイズの影響を小さくするために大きなL/Wを持た せると共にゲート容量を大きくする事が望ましい。

【0050】とのようにして形成されたTFTを用い て、以下の各実施例に示す駆動回路を構成した。

【0051】<実施例1>図1は、本発明の画像表示装 置の第1の態様を示した回路図である。図において、第 1のスイッチング素子M1は、その制御端子 (ゲート) が選択線Sel に接続されるとともに、被制御端子の一 端(ドレイン)が表示素子の一端(カソード)と、第3 のスイッチング素子M3の被制御端子の他端(ソース) と、第2のスイッチング素子M2の被制御端子の一端 (ドレイン)とに接続されている。また、その被制御端 子の他端(ソース)は、駆動信号を与えるビデオ信号線 Vidと接続されている。

【0052】また、第3のスイッチング素子M3の制御 端子(ゲート)は、選択線Sel と接続され、被制御端 子の一端(ドレイン)は第2のスイッチング素子M2の 制御端子(ゲート)と接続されている。また、その被制 御端子の他端(ソース)は、前記第1のスイッチング素 子M1の被制御端子の一端(ドレイン)と同様である。 前記第2のスイッチング素子の被制御端子の他端 (ソー ス)は、接地線Vcomに接続されている。また、その被 制御端子の一端(ドレイン)側は、前記第1のスイッチ ング素子M l の被制御端子の一端(ドレイン)と同様で

【0053】また、第4のスイッチング素子M4の制御 電極(ゲート)は、選択線Sel と接続され、被制御端 子の一端(ドレイン)は、表示素子D1の他端(アノー ド) と接続され、その他端 (ソース) は電源線 V D と接 続されている。

【0054】なお、この例では、第1~第4のスイッチ ング素子は、c-MOSタイプのTFTにより構成し、 それぞれ第1のスイッチング素子M1がNチャンネル、 第2のスイッチング素子M2がNチャンネル、第3のス イッチング素子M3がNチャンネル、第4のスイッチン 50 グ素子M4がPチャンネルとなっている。

【0055】また、電源線VD、および接地線Vcom は 表示素子を駆動するために十分な電流を供給しうるもの であって、図示しない他の画素(表示素子)や、電源回 路と接続されている。選択線Sel からは、表示素子 (画素)を選択するための信号が与えられる。 この例で は、画素選択後に表示素子D1が発光する。ビデオ信号 線Vid からは、表示素子を駆動するための駆動信号が 与えられる。との駆動信号は、表示画素を所望の輝度で 【0048】M1、M2、M4は十分なON/OFF比 10 発光させるための駆動電流に相当する電流信号として与 えられる。との駆動信号により画素が発光し、階調制御

12

【0056】次に、とのような構成の回路の動作につい て説明する。いま、選択線Sel をH(ハイレベル)にす る事により第1のスイッチング素子M1、第3のスイッ チング素子M3をONに、第4のスイッチング素子M4 をOFFにする。同時にビデオ信号線Vid より、駆動 信号として表示素子(有機EL素子)Dlに流したい電 流を定電流源によって入力する。

【0057】との時、電源線VD、選択線Sel、接地線 V com の各ラインには第1 および第3のスイッチング素 子M1, M3が十分なIonが得られ、第4のスイッチン グ素子M4に十分な I off が得られる電位を入力しなけ ればならない。ただし、ビデオ信号線Vid は、いま定 電流入力であり、第2のスイッチング素子M2の素子特 性によって電位は定まる。本実施例では各電位が以下の 様になる。

選択線Sel 10 V ビデオ信号線Vid 最大5 V 30 電源線VD 1 0 V 接地線V com -5 V

や表示色制御が行われる。

【0058】この時、第2のスイッチング素子M2と定 電流源の負荷特性は図8のaのようになりPの電位はV pになる。この時TFTの素子のばらつきより第3のス イッチング素子M3の負荷特性が図8のbとなった時は Pの電位はVp'となる。

【0059】本実施例で1µAの電流を流そうとした 時、Pの電位は~-1V近辺になり素子の特性によって 異なる値をもつ。

【0060】次に、選択線Sel をL (ロウレベル) に する事により第1のスイッチング素子M1、第3のスイ ッチング素子M3をOFFに、第4のスイッチング素子 M4をONにする。

【0061】この時、電源線VD、選択線Sel 、接地線 V com の各ラインには第1 および第3 のスイッチング素 子MI、M3に十分なIoff が得られ、第4のスイッチ ング素子M4に十分なIonが得られる電位を入力しなけ ればならない。本実施例では選択線Selを-5Vに変 化させた。

【0062】第3のスイッチング索子M3がOFFされ

ることにより、第2のスイッチング素子M2のゲート電位は上記のVpが保持される。この時の表示素子D1と、第2のスイッチング素子M2の負荷特性から、第2のスイッチング素子M2が飽和領域で動作することとなり、上記で入力された駆動信号の電流値とほぼ同じ電流値が表示素子D1に流れることになる。なおこの時、第4のスイッチング素子M4の抵抗は、表示素子D1、第2のスイッチング素子M2に比べて十分低いので無視することができる。

【0063】とのときに流れる電流を決定するのは、上 10 記P点に現れたVpであり、これは素子のばらつきによって変化はするが必ず上記で入力した駆動信号の電流を第2のスイッチング素子M2に流そうとする。これにより、第2のスイッチング素子M2の特性のばらつきに関係なく一定量の電流値を流すことが可能になり、画質を向上させることができる。

【0064】<実施例2>実施例2は実施例1を発展させたものである。対角が4インチ以上の直視型ディスプレイを実現する場合、ビデオ信号線Vidを引き回すこととなるが、これにより寄生容量が付加されてしまう。いまパネルが高解像度になるにつれ、一画素あたりの書き込み時間が短くなる。そして、前述の寄生容量の影響により、各表示素子に流したい電流値をそのまま対象とする表示素子に供給することが困難になる。

【0065】そこで、図2に示すように、容量C1を第1のスイッチング素子M1の被制御端子の一端と、第2のスイッチング素子M2の被制御端子の一端との間に直列に配置する。また、供給する駆動信号も電圧信号とし、これをこの容量C1により電圧/電流変換して電流信号とし、第2のスイッチング素子M2に供給する。この電圧信号は、駆動電流に対応した電圧信号として与えられるが、通常のこぎり波形を発生する電圧源から供給する。なお、電圧/電流変換は、一般に1=ΔV×Cとして与えられる。

【0066】いま、のとぎり波形の電圧の上昇する傾きを $\Delta V r$ (単位V/S)とすると選択時間にC1を介して第2のスイッチング素子M2に流れる電流は、 $C1 \times \Delta V r$ となる。

【0067】その他の構成要素は実施例1と同様であり、同一構成要素には同一符号を付して説明を省略する。

【0068】このようにして構成した回路と駆動方法を用いた時、前述の電流値は、電圧波形、好ましくは時間変化により増大する波形であって、具体的にはのこぎり状の波形となるので、ビデオ信号線Vidの寄生容量の影響を受けることなく、第2のスイッチング素子M2に駆動電流を流すことができる。これによってパネルサイズを大きくすることができ、大画面のディスプレイにも対応することができるとともに、高解像度になっても求める電流値を各表示素子に入力することができる。

【0069】<実施例3>実施例3は実施例2を発展させたものである。高解像度になるほど各画素の面積は小さくなり画素中に占めるTFT等の回路部品の割合が大きくなってしまう。そこで、図3に示すように、表示素子側に配した選択TFT、すなわち第4のスイッチング素子M4を廃し、表示素子D1の他端(アノード)を直接電源線VDに接続する。そして、選択時間の間、電源VDの電位をP点の電位より低く保ち、これによって表示素子、特に有機EL素子の有するダイオード特性により実施例1の第4のスイッチング素子M4のOFF状態と同じ状態を作る。つまり、表示素子、特に有機EL素子には逆バイアスがかかっているので、電流を流さない状態をつくりP点の電位を実施例1の選択時と同様に決定する事ができる。

14

【0070】その他の構成要素は実施例2と同様であり、同一構成要素には同一符号を付して説明を省略する。

【0071】<実施例4>実施例4は実施例2を発展させたものである。高解像度になる程、第1のスイッチング素子M1、第4のスイッチング素子M4、第3のスイッチング素子M3は高速でスイッチングする必要が生じる。そして、それによるスイッチングノイズの影響が大きくなる。そこで、図4に示すように、第2のスイッチング素子M2の制御電極と被制御電極の他端間(ゲートーソース間)に容量C2を付加し、スイッチングノイズの影響を小さくさせる。これによって高解像度でも正確に求める電流を表示素子(有機EL素子)に流すことができるようになる。

【0072】なお、スイッチングノイズの低減には第1のスイッチング素子M1、第4のスイッチング素子M4、第3のスイッチング素子M3のTFTスイッチをc-MOSで形成された、トランスファーゲートに変更することも有効である。この場合、スイッチとしての供給能力を高めることができると同時に、相反する制御信号がトランスファーゲートを構成するスイッチング素子(TFT)に供給されるため、スイッチングノイズを打ち消し合うことができる。

【0073】その他の構成要素は実施例2と同様であり、同一構成要素には同一符号を付して説明を省略す40 る。

【0074】<実施例5>実施例5は実施例2を発展させたものである。表示素子として好ましく用いられる有機EL素子は、陰極に用いられる材料がフォトリソ等ウェットプロセスに晒されると劣化し効率が低下しやすい。そこで、図5に示すように、回路の構成を本実施例に示すように変更することにより、有機EL素子の陰電極を共通化し、分離を不要にしてウェットプロセスによるダメージを与えないようにする。これにより、高効率の有機EL素子を有効に利用することができる。

50 【0075】図において、第1のスイッチング素子M1

16

は、その制御端子(ゲート)が選択線 Sel に接続されるとともに、被制御端子の一端(ドレイン)は容量Clの一端に接続され、その被制御端子の他端(ソース)は、駆動信号を与えるビデオ信号線 Vid と接続されている。

【0076】また、第3のスイッチング素子M3の制御端子(ゲート)は、選択線Sel と接続され、被制御端子の他端(ソース)は、容量C1の他端と、第4のスイッチング素子M4の被制御端子の他端(ソース)と、第2のスイッチング素子M2の被制御端子の一端(ドレイ 10ン)と接続されている。また、その被制御端子の一端(ドレイン)は、第2のスイッチング素子M2の制御端子(ゲート)と接続されている。

【0077】前記第2のスイッチング素子M2の被制御端子の他端(ソース)は、電源線VDと接続され、その被制御端子の一端(ドレイン)は、前記第3のスイッチング素子M3の被制御端子の他端(ソース)と同様である。

【0078】また、第4のスイッチング素子M4の制御電極(ゲート)は、選択線Sel と接続され、被制御端子の一端(ドレイン)は、表示素子D1の他端(アノード)と接続され、その他端(ソース)は、前記第3のスイッチング素子M3の被制御端子の他端(ソース)と同様である。そして、表示素子D1の一端(カソード)は、接地線Vcomと接続されている。

【0079】次に、このような構成の回路の動作について説明する。いま、選択線SelをHにする事により第1のスイッチング素子M1、第3のスイッチング素子M3をONに、第4のスイッチング素子M4をOFFにする。同時にビデオ信号線Vidより、駆動信号として表示素子(有機EL素子)D1に流したい電流をに対応した電圧信号を、実施例2と同様に入力する。この場合、信号の向きは上記実施例2とは逆、すなわちマイナス側となる。

【0080】との時、電源線VD、選択線Sel、接地線Vcomの各ラインには第1および第3のスイッチング素子M1、M3が十分なIonが得られ、第4のスイッチング素子M4に十分なIoffが得られる電位を入力しなければならない。ただし、ビデオ信号線Vidは、いま定電流入力であり、第2のスイッチング素子M2の素子特40性によって電位は定まる。本実施例では各電位が以下の様になる。

 選択線Sel
 10V

 ビデオ信号線Vid
 最小0V

 電源線VD
 10V

 接地線Vcom
 -5V

【0081】次に、選択線SelをLにする事により第 1のスイッチング素子M1、第3のスイッチング素子M 3をOFFに、第4のスイッチング素子M4をONにする。 【0082】との時、電源線VD、選択線Sel、接地線Vcomの各ラインには第1および第3のスイッチング素子M1、M3に十分なIoffが得られ、第4のスイッチング素子M4に十分なIonが得られる電位を入力しなければならない。本実施例では選択線Selを0Vに変化させた。

【0083】第3のスイッチング素子M3がOFFされることにより、第2のスイッチング素子M2のゲート電位は実施例2と同様にVpが保持される。この時の表示素子D1と、第2のスイッチング素子M2の負荷特性から、第2のスイッチング素子M2が飽和領域で動作することとなり、上記で入力された駆動信号に対応した電流値とほぼ同じ電流値が表示素子D1に流れることになる。

【0084】<実施例6>実施例6は実施例5を発展させたものである。図6に示すように、実施例3と同様に第4のスイッチング素子M4、つまりTFTを1つ減らすことにより回路部品が画素に占める面積を減らすことができる。この時、実施例3と同様に、選択間Vcomのの値を制御し、表示素子、特に有機EL素子を逆バイアス状態にする。

【0085】その他の構成要素は実施例5と同様であり、同一構成要素には同一符号を付して説明を省略する。

[0086]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、Pol y-Siの粒径による特性のばらつきの影響をなくし、 表示面のばらつきを改善することができる。

【図面の簡単な説明】

0 【図1】本発明の画像表示装置の第1の態様を示した回路図である。

【図2】本発明の画像表示装置の第2の態様を示した回路図である。

【図3】本発明の画像表示装置の第3の態様を示した回 路図である。

【図4】本発明の画像表示装置の第4の態様を示した回路図である。

【図5】本発明の画像表示装置の第5の態様を示した回 路図である。

40 【図6】本発明の画像表示装置の第6の態様を示した回 路図である。

【図7】第3のスイッチング素子の動作を説明する等価 回路図である。

【図8】第3のスイッチング素子の [/V特性を示した グラフである。

【図9】本発明の画像表示装置を構成するTFTの、一製造工程を示した概略断面図である。

【図10】本発明の画像表示装置を構成するTFTの、 一製造工程を示した概略断面図である。

50 【図11】本発明の画像表示装置を構成するTFTの、

*

18

一製造工程を示した概略断面図である。

【図12】本発明の画像表示装置を構成するTFTの、

一製造工程を示した概略断面図である。

【図13】本発明の画像表示装置を構成するTFTの、 一製造工程を示した概略断面図である。

【図14】本発明の画像表示装置を構成するTFTの、

一製造工程を示した概略断面図である。

【図15】本発明の画像表示装置を構成するTFTの、

一製造工程を示した概略断面図である。

【図16】本発明の画像表示装置を構成するTFTの、

一製造工程を示した概略断面図である。

【図17】従来のアクティブマトリックス型の有機EL

表示装置の一例を示したブロック構成図である。

【図18】図17のA部を拡大した回路図である。

【符号の説明】

M 1 第1のスイッチング素子 * M2 第2のスイッチング素子

МЗ 第3のスイッチング素子

M4 第4のスイッチング素子

D 1 表示素子

C1, C2 容量

Vid ビデオ信号線

Se1 選択線

V D 電源線

V com接地線

101 基板 10

> 102 シリコン酸化膜

103 アモルファスシリコン層

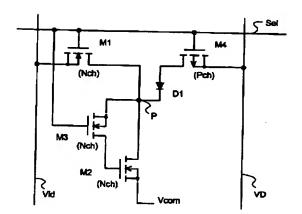
103a 活性層

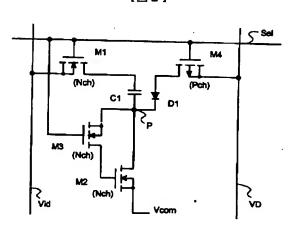
104 ゲート酸化膜

ゲート電極 105

【図1】

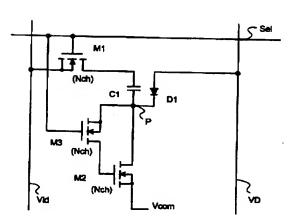
[図2]

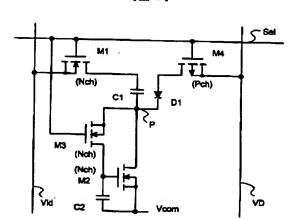


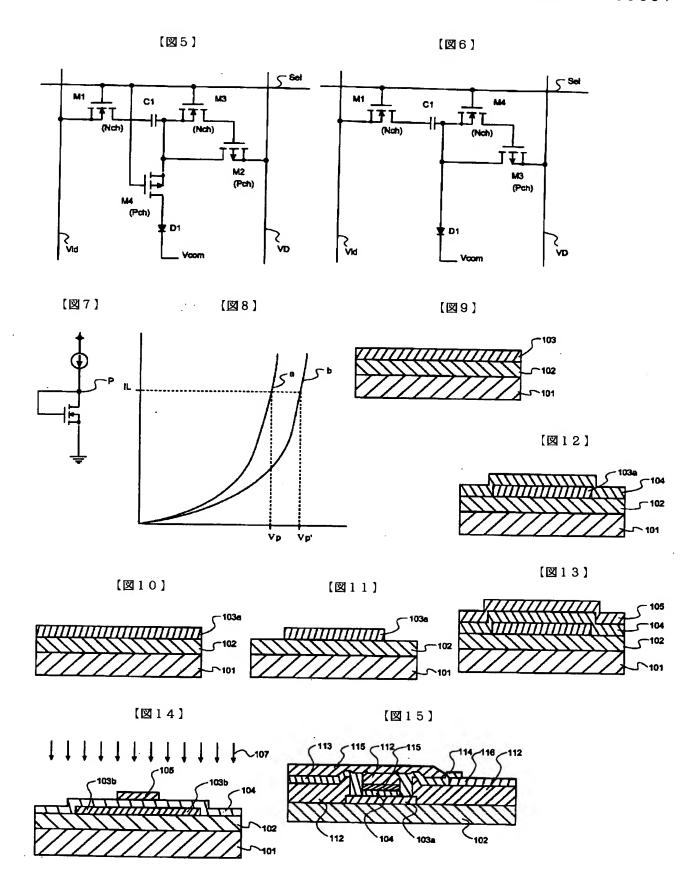


【図3】

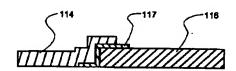
【図4】

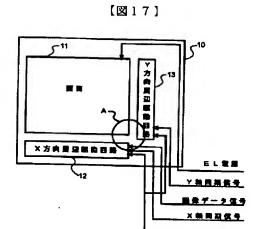






【図16】





【図18】

